

名古屋工業大学 産学官金連携機構設備共用部門 「表面分析セミナーⅠ～飛行時間型2次イオン 質量分析装置 (TOF-SIMS)～」のご案内

近年の高度な技術的課題や厳密な品質管理への迅速な取り組みにおいて、先端分析設備の果たす役割がますます重要になってきています。当設備共用部門では、先端分析設備の計画的な整備・更新を行うと共に、広く学内外のみなさまにご活用いただけるよう活動しております。

本セミナーでは、試料表面の構造解析を行う飛行時間型2次イオン質量分析装置 (TOF-SIMS) について、アルバック・ファイ株式会社様から講師をお招きし、装置の基礎的な原理から、実際の測定事例、最新の動向につきましてご講演を頂くとともに、学外向け受託試験の詳細について紹介いたします。

本セミナー後、本来ならば、装置を実際にご覧いただく見学会を行う予定でございましたが、今回はコロナ禍ということで、見学会は実施いたしません。なお、装置の見学をご希望される方へは別途個別に見学会を行います。併せて、受託試験のご相談等もお受けいたしますので、お申し込み時にお知らせ下さい。

みなさまの教育・研究・開発・企業経営に当設備共用部門をご活用いただく契機として、本セミナーへのご参加をお待ちしております。

日時: 2021年11月11日(木) 13:30～15:20

会場: Microsoft Teamsによるオンライン開催

プログラム

13:30 ～ 13:35 挨拶

名古屋工業大学産学官金連携機構長 江龍 修

13:35 ～ 15:05 講演

「TOF-SIMSの原理と応用例」

アルバック・ファイ(株)製品戦略部ソリューション開発室 星 孝弘 氏

15:05～ 15:20

「産学官金連携機構設備共用部門受託試験のご案内」

●参加ご希望の皆様へ(申込方法)

以下のページよりお申し込み下さい。フォームに入力されたメールアドレス宛に参加URLをお送りします。

お申し込みフォーム: <https://kiki.web.nitech.ac.jp/eq-seminar202110/>

お問い合わせ: 名古屋工業大学 産学官金連携機構設備共用部門

TEL: 052-735-5533

E-mail: oogata-jim@adm.nitech.ac.jp

URL: <https://kiki.web.nitech.ac.jp/>

